



[学院首页](#)
[学院介绍](#)
[新闻公告](#)
[科学研究](#)
[本科生教学](#)
[研究生教学](#)
[党建工作](#)
[常用下载](#)
[办公指南](#)

师资队伍

张希仁



生日: **1977年03月**
 性别: **男**
 职务: **无**
 职称: **副教授**
 电话: **83201960**
 邮箱: **xiren3208@163.com**

全部

教授

研究员

副教授

副研究员

高级工程师

高级实验师

实验师

讲师

助教

助理实验师

助理研究员

团队介绍

低维光电材料与真空器件

信息显示与光电技术

光电子器件与应用技术

光电视觉信息处理与微波技

术

红外探测与传感技术团队

个人简历

2004年6月毕业于西安交通大学电子与信息工程学院, 获硕士学位; 2008年毕业于中国科学院光电技术研究所(成都), 获博士学位。2007年获中国科学院院长奖学金。2008年3月进入电子科技大学光电信息学院任教。先后参与国家自然科学基金、四川省青年基金和中科院光电所领域前沿部署课题等项目。目前主持国家自然科学基金1项。先后在*Appl. Phys. Lett.*, *J. Appl. Phys.*, *Eur. Phys. J. Special Topic*、《物理学报》和*Chin. Phys. B* 等国内外学术期刊上发表论文10余篇, 其中第一作者论文被SCI收录6篇。

研究方向

光声光热成像技术、材料无损检测以及光信息处理等领域的研究。

获奖情况

主要论著

主要论文如下:

Zhang Xi-Ren, Gao Chun-Ming, Zhou Ying, and Wang Zhan-Ping, Measurement accuracy analysis of the free carrier absorption determination of the electronic transport, *Chin. Phys. B* Vol. 20, No. 6 (2011)068105 (SCI源刊).

Xiren Zhang, Bincheng Li, Yudong Zhang, Measuring the electronic transport properties of Si wafers with laser-induced free-carrier dynamics, *2006 OSA Annual Meeting Frontiers in Optics - Laser Science XXII (FIO-LS)*, 2006.10: JWD118 (光盘收录).

Xiren Zhang, Bincheng Li, and Chunming Gao, Electronic transport characterization of silicon wafers by laterally resolved free carrier absorption and multiparameter fitting, *Appl. Phys. Lett.*, 2006 89(11): 112120-1-112120-3 (SCI源刊).

Xiren Zhang, Bincheng Li, and Chunming Gao, Analysis of free carrier absorption measurement of electronic transport properties of silicon wafers, *Eur. Phys. J. Special Topics*, 2008, 153, 279-281 (SCI源刊).

Xiren Zhang, Bincheng Li, and Xianming Liu, Sensitivity analysis of laterally-resolved modulated free carrier absorption determination of electronic transport properties of Si wafer, *J. Appl. Phys.*, 2008, **103**, 033709-1-033709-7 (SCI源刊).

张希仁, 李斌成, 刘显明, 调制自由载流子吸收测量半导体载流子输运参数的三维理论, *物理学报*, 2008, **57**, 7310-7316 (SCI源刊).

Xiren Zhang, Bincheng Li, and Xianming Liu, Accuracy analysis for the determination of electronic transport properties of Si wafers using modulated free carrier absorption, *J. Appl. Phys.* 2008, **104**, 103705-1-103705-7 (SCI源刊).

Chunming Gao, Bincheng Li, and **Xiren Zhang**, Time-domain modulated free-carrier absorption measurements of the recombination process in silicon, *Eur. Phys. J. Special Topics*, 2008, 153, 275-277 (SCI源刊).

Xianming Liu, Bincheng Li, and **Xiren Zhang**, Photocarrier radiometric and ellipsometric characterization of ion-implanted silicon wafers, *J. Appl. Phys.*, 2008, **103**, 123706 (SCI源刊).

张希仁, 李斌成, 自由载流子吸收测量半导体电子输运特性 [C], *中国光学学会2006年学术大会论文摘要集*, 2006, 09-P46.